ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 078

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 18 z/of 14.10.2026

AP 078	Nazwa i adres / Name and address **POLITECHNIKA WROCŁAWSKA** **ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27** **50-370 Wrocław** **KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI** **LABORATORIUM WZORCÓW I METROLOGII POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO** **ul. Zygmunta Janiszewskiego 9** **50-372 Wrocław**
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) at permanent location (S)	**Wzorcowanie / Calibration:** Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand*) 9.01 wielkości magnetyczne 9.02 wielkości elektromagnetyczne

Wersja strony/Page version: A

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 078 z dnia 27.06.2022 r.
Cykl akredytacji od 01.09.2025 r. do 22.09.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No AP 078 of 27.06.2022
Accreditation cycle from 01.09.2025 to 22.09.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego ul. Zygmunta Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	**Zakres pomiarowy**	**Niepewność pomiaru dla CMC**	**Miejsce dział.**	**Metoda pomiarowa**
Wielkości magnetyczne				
Mierniki do pomiaru pól magnetostatycznych **Mierniki indukcji magnetycznej**	0 Hz **0,01 kA/m do 10 kA/m** **10 kA/m do 1000 kA/m**	 **2,8 %** **1,0 %**	**S**	**Procedury wewnętrzne PrW-1, PrW-4 w oparciu o IEEE 1309-2013** **Metoda pośrednia**
Wielkości elektromagnetyczne				
Mierniki natężenia pola magnetycznego **Mierniki indukcji magnetycznej**	50 Hz **0,1 A/m do 50 kA/m** 1 Hz do 1000 Hz **0,01 A/m do 10 kA/m** 0,001 MHz do 1 MHz **0,1 A/m do 250 A/m** 1 MHz do 10 MHz **0,001 A/m do 200 A/m** **10** MHz do 100 MHz **0,001 A/m do 20 A/m**	 **2,8 %** **2,8 %** **5 %** **5 %** **5 %**	**S**	**Procedury wewnętrzne PrW-1, PrW-4 w oparciu o IEEE 1309-2013** **Metoda pośrednia**
Mierniki natężenia pola elektrostatycznego **Mierniki natężenia pola elektrycznego** **Mierniki natężenia pola magnetycznego**			**S**	**Procedury wewnętrzne PrW-2, PrW-4 w oparciu o IEEE 1309-2013**
Pole E	0 MHz do 50 Hz **10 V/m do 50kV/m** 0,01 kHz do 100 kHz **1 V/m do 2 kV/m** 0,01 MHz do 220 MHz **0,001 V/m do 2000 V/m** 10 MHz do 1000 MHz **0,001 V/m do 1000 V/m**	 **2,8 %** **2,8 %** **5 %** **5 %**		**Metoda pośrednia**
Pole H	0,01 MHz do 220 MHz **0,3 mA/m do 5 A/m** 10 MHz do 1000 MHz **3 mA/m do 2,5 A/m**	 **5 %** **5 %**		
Mierniki natężenia pola elektrycznego **Mierniki gęstości mocy**	1 GHz do 10 GHz **0,00001 W/m^2 do 50 W/m^2** **0,06 V/m do 137 V/m** 10 GHz do 20 GHz **0,001 W/m^2 do 50 W/m^2** **(0,6 V/m do 137 V/m** 20 GHz do 50 GHz **0,001 W/m^2 do 50 W/m^2** **0,6 V/m do 137 V/m** 50 GHz do 90 GHz **0,001 W/m^2 do 0,5 W/m^2** **0,6 V/m do 14 V/m**	 **15 %** **25 %** **35 %** **38 %**	**S**	**Procedury wewnętrzne PrW-3, PrW-4 w oparciu o IEEE 1309-2013** **Metoda pośrednia**
Mierniki prądu indukowanego	**0,0001** MHz do 110 MHz **0,001 A do 1,5 A**	 **10 %**	**S**	**Procedury wewnętrzne PrW-5, PrW-4 w oparciu o IEEE 1309-2013** **Metoda pośrednia**

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 078

Status zmian: wersja pierwotna – A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 14.10.2026 r.